

METROLOGÍA EN AERONÁUTICA

JORNADA TÉCNICA Y VISITA

JORNADA GRATUITA

IMPRESINDIBLE [REGISTRO](#)

FECHA: 12 DICIEMBRE 2018, MIÉRCOLES

HORA: 09:30 – 13:30

LUGAR: [PARQUE TECNOLÓGICO, 101](#)
ZAMUDIO

(EDIFICIO PPAL. DEL PARQUE)

9:30h: Registro y Bienvenida

9:40h: *Metrologia de 5 ejes 4.0 aplicada al sector aeronáutico y espacial.*

Iñaki DE PAZ (CMM Product Manager) de **Renishaw**

10:30h: *Soluciones híbridas de metrología al servicio del control de la producción aeroespacial*

Héctor VEGA (Innovation Manager) y **Álvaro MORQUECHO** (R&D Manager) de **Metrología Sariki**

11:20h: Descanso café

11:50h: *La necesidad de medirlo todo, de la punta de la herramienta a la punta del álabe*

Naiara ORTEGA (Associate Professor) de la **UPV/EHU**

12:40h: Visita al CFAA-Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica

(EDIF. 202)

Durante la visita contaremos con un técnico de Renishaw UK que mostrará la medición de un Blisk en maquina CMM de 5 ejes en continuo

13:30h: Fin Previsto